j

Practitioner's Docket No.: 782 205

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the application of:

Yuji KATSUDA and Hideyoshi TSURUTA

Ser. No.: 10/020,499

Group Art Unit: 1754

Filed: December 14, 2001

Examiner:

Not Assigned

Conf. No.: 8724

ALUMINUM NITRIDE SINTERED BODIES AND MEMBERS FOR SEMICONDUCTOR-PRODUCING APPARATUSES

Box Missing Parts
Assistant Commissioner for Patents
Washington, DC 20231

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail addressed to Box Missing Parts, Assistant Commissioner for Patents, Washington D.C. 20231 on May 2, 2002.

Elizabeth A VanAntwerp

SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following foreign country was requested by applicants on December 14, 2001 for the above-identified application:

Country

Application Number

Filing Date

Japan

2000-388,183

December 21, 2000

In support of this claim, a certified copy of the Japanese Application is enclosed herewith.

Respectfully submitted,

May 2, 2002

Date

Stephen P. Burr

Reg. No. 32,970

SPB/eav

BURR & BROWN P.O. Box 7068

Syracuse, NY 13261-7068

Customer No.: 25191

Telephone: (315) 233-8300 Facsimile: (315) 233-8320

PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Date of Application : December 21, 2000

Application Number : Japanese Patent Application

No. 2000-388183

Applicant(s) : NGK INSULATORS, LTD.

Certified on December 7, 2001

Commissioner,

Patent Office Kozo OIKAWA (Sealed)

Certification No. 2001-3106634



日

PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年12月21日

出願

Application Number:

人

特願2000-388183

出 Applicant(s):

日本碍子株式会社

2001年12月 7 日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



.特2000-388183

【書類名】

特許願

【整理番号】

00P00746

【提出日】

平成12年12月21日

【あて先】

特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】

C04B 35/58

【発明の名称】

窒化アルミニウム焼結体及び半導体製造装置用部材

【請求項の数】

12

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式

会社内

【氏名】

勝田 祐司

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式

会社内

【氏名】

鶴田 英芳

【特許出願人】

【識別番号】

000004064

【氏名又は名称】 日本碍子株式会社

【代理人】

【識別番号】 100072051

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉村 興作

【選任した代理人】

【識別番号】 100059258

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉村 暁秀

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 074997

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9703804

【書類名】

明細書

【発明の名称】 窒化アルミニウム焼結体及び半導体製造装置用部材

【特許請求の範囲】

【請求項1】窒化アルミニウムを主成分とし、希土類金属元素を酸化物換算で○ . 3 m o 1 %以上、2. 0 m o 1 %以下、アルミナを 0. 2 m o 1 %以上、1. Omo1%以下含有しており、Siの含有量が80ppm以下であり、窒化アル ミニウム粒子の平均粒径が3μm以下であることを特徴とする、窒化アルミニウ ム焼結体。

【請求項2】前記希土類金属元素(酸化物換算量)とアルミナとのモル比(希土 類酸化物/アルミナ)が1.0以上、3.0以下であることを特徴とする、請求 項1記載の焼結体。

【請求項3】マイクロビッカース硬度が1100以上であることを特徴とする、 請求項1または2記載の焼結体。

【請求項4】四点曲げ強度が400MPa以上であることを特徴とする、請求項 1-3のいずれか一つの請求項に記載の焼結体。

【請求項5】熱伝導率が130W/mK以上であることを特徴とする、請求項1 4のいずれか一つの請求項に記載の焼結体。

【請求項6】室温における体積抵抗率が $1 \times 10^{14} \Omega \cdot c$ m以上であることを特 徴とする、請求項1-5のいずれか一つの請求項に記載の焼結体。

【請求項7】希土類金属元素を除く金属不純物元素の総含有量が300重量pp m以下であることを特徴とする、請求項1-6のいずれか一つの請求項に記載の 焼結体。

【請求項8】希土類金属元素を除く金属不純物元素の総含有量が50重量ppm 以下であることを特徴とする、請求項7記載の焼結体。

【請求項9】請求項1-8のいずれか一つの請求項に記載の焼結体によって少な くとも一部が構成されていることを特徴とする、半導体製造装置用部材。

【請求項10】前記焼結体からなる基材と、この基材中に埋設されている金属部 材とを備えていることを特徴とする、請求項9記載の部材。

【請求項11】前記金属部材が少なくともヒーター用電極を含むことを特徴とす

る、請求項10記載の部材。

【請求項12】前記金属部材が少なくとも静電チャック用電極を含むことを特徴とする、請求項10または11記載の部材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、窒化アルミニウム焼結体およびこれを利用 した半導体製造装置用部材に関するものである。

[0002]

【従来の技術】窒化アルミニウムを主体とする材料は、半導体製造用ヒーター、静電チャック等へ適用されている。窒化アルミニウム原料粉末に対して、希土類金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物等の焼結助剤を添加することにより、焼結助剤が窒化アルミニウム粉末の表面の不純物酸素(アルミナ)と反応し、希土類金属-A1-Oもしくはアルカリ土類金属-A1-Oからなる液相を生成し、緻密化と粒成長が促進される。併せて不純物酸素のトラップ効果(希土類金属-A1-O生成、アルカリ土類金属-A1-O生成)により、窒化アルミニウム内への酸素の固溶を抑制し、高熱伝導化する。

【0003】例えば、本出願人は、特開平9-315867号公報において、高純度の窒化アルミニウムに酸化イットリウムを微量添加することによって、その体積抵抗率を室温で $10^8-10^{12}\Omega$ ・c mに制御できることを開示した。

【0004】また、特公昭63-46032号公報においては、酸素を1重量%含む窒化アルミニウムを主成分とし、これにイットリウム、ランタン、プロセオジム、ニオブ、サマリウム、ガドリニウム、ジスプロシウムの酸化物を0.01-15重量%添加した原料を得、この原料を成形、焼結して、酸素を0.01-20重量%含む、熱伝導率の高い窒化アルミニウム焼結体を製造しようとしている(請求の範囲)。この実施例1においては、酸素を1重量%含有する窒化アルミニウム粉末(平均粒径1μm)に酸化サマリウム粉末を3重量%添加し、混合し、圧力300kg/cm2、温度1800℃で1時間ホットプレスすることによって、室温での熱伝導率が121W・m/kの焼結体を得ている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】CVDやスパッタリングなどの製膜工程においては、ウエハー上に半導体薄膜をエピタキシャル成長させる必要があるために、一般的には、ウエハーを100℃以上、特に200℃以上の高温領域に加熱する必要が生じる。この際には、静電チャックに内蔵されたヒーター、あるいは静電チャックの下方において静電チャックと接触するように設けられたヒーターなどによって、静電チャックの吸着面を加熱する。

【0006】静電チャックにおいては、ウエハーを静電チャックの吸着面に設置した段階では、ウエハーの温度が低く、吸着後にウエハーの温度が飽和温度に向かって上昇していく。こうした静電チャックおよび半導体製造装置においては、吸着直後のウエハーと静電チャックとの接触に伴う衝撃によって、および接触後のウエハーの熱膨張による変形によって、窒化アルミニウム粒子が脱粒し、パーティクルが発生し得る。

【0007】本発明の課題は、窒化アルミニウム粒子が脱粒しにくく、高温領域、例えば $300~\sim500~\%$ において $10^8~\Omega$ ・c m以上の高抵抗値を示し、熱伝導率も比較的高い窒化アルミニウム焼結体を提供することである。

【0008】また、本発明の課題は、こうした窒化アルミニウム焼結体を利用することで、半導体製造装置内で脱粒しにくく、高温領域、例えば300~500 $^{\circ}$ において10 $^{\circ}$ $^{\circ$

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、窒化アルミニウムを主成分とし、希土類金属元素を酸化物換算で0.3mo1%以上、2.0mo1%以下、アルミナを0.2mo1%以上、1.0mo1%以下含有する窒化アルミニウム焼結体であって、Siの含有量が80ppm以下であり、窒化アルミニウム粒子の平均粒径が 3μ m以下であることを特徴とする、窒化アルミニウム焼結体に係るものである。

【0010】また、本発明は、前記焼結体によって少なくとも一部が構成されていることを特徴とする、半導体製造装置用部材に係るものである。

【0011】本発明者は、窒化アルミニウム焼結体の原料に対して、希土類金属

元素の化合物とアルミナとを添加し、焼成することにより、高い熱伝導率が得られるのと同時に、焼結体内での窒化アルミニウム粒子の粒成長が抑制され、高硬度な焼結体が得られることを見出した。

【0012】希土類酸化物は熱伝導率を向上させるために必要である。しかし、 希土類酸化物のみを添加した場合には、高い熱伝導率が得られるが、粒成長が促進されることと、十分な量の希土類-A1-O粒子を分散させることができない ため、高硬度と高強度とが得られない。従って、窒化アルミニウム焼結体をウエ ハー等に対して接触させたときに、十分な脱粒特性改善効果が得られない。

【0013】これに対して、希土類金属元素とアルミナとを同時添加することで、焼結体が高硬度化した理由は、以下のように推定される。即ち、希土類-A1-Oからなる粒界相を窒化アルミニウム粒子の三重点近傍に局在化させたことによって、粒子分散効果が得られたものと考えられる。これにより焼結体の強度も向上している。アルミナの添加は、A1N中の希土類-A1-O相の体積を増やし、分散粒子量を増やすために必要であり、かつ粒成長を抑制する効果を得る上でも必要である。

【0014】窒化アルミニウム焼結体の硬度を高くし、かつ耐蝕性の低い金属元素を少なくすることによって、ウエハー吸脱着時の擦れによる窒化アルミニウム粒子の脱粒を低減できる。

【0015】焼結体における希土類金属元素の量は、酸化物換算で0.3 mol%以上とし、これによって高い熱伝導率が得られる。この観点からは0.4 mol%以上とすることが更に好ましい。焼結体における希土類金属元素の量は、酸化物換算で2.0 mol%以下とし、これによって硬度等が特に高くなる。この観点からは1.5 mol%以下とすることが一層好ましい。

【0016】焼結体におけるアルミナの量は0.2mol%以上とし、これによって、窒化アルミニウム粒子の粒径が低く抑えられ、焼結体の硬度、強度が高く保持される。この観点からは、アルミナの量を0.25mol%以上とすることが更に好ましい。

【0017】焼結体におけるアルミナの量は酸化物換算で1.0mo1%以下とし、これによって、熱伝導率の低下を少なくすることができる。この観点からは

、0.60m01%以下とすることが更に好ましい。

【0018】希土類金属元素(酸化物換算量)とアルミナとのモル比(希土類酸化物/アルミナ)を1.0以上、3.0以下とすることによって、より高い熱伝導率と硬度および強度との両立が可能である。この観点から、前記モル比を1.2以上とすることが更に好ましく、また、2.5以下とすることが更に好ましい

【0019】希土類元素としては、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Luが好ましい。

【0020】Siは、成膜プロセスにおいて特にハロゲン系クリーニングガスに対して腐食されやすい。窒化アルミニウム材料内に不純物として混入したSiは、粒内固溶及び/又は粒界析出の形で存在しているが、このSiの腐食速度は大きいことが予想され、選択的に腐食される。この結果、Siの近傍にある窒化アルミニウム粒子の脱粒が促進され、もしくはSiの近傍にある窒化アルミニウム粒子同士の結合を弱くし、ウエハーの吸脱着時の擦れによる脱粒が促進される。

【0022】本発明においては、窒化アルミニウム粒子を微細化することにより、焼結体表面を研磨仕上げした後の表面粗さを非常に小さく制御できる。これにより、ウエハー吸脱着時のウエハーと窒化アルミニウムとの接触点数(吸着箇所)が増えることにより、吸脱着にかかる窒化アルミニウム粒子への応力(負荷)が分散され、脱粒しにくくなる。窒化アルミニウム粒子径とRa、Rtにも概ね相関があり、粒径が小さいほどRa、Rtの小さい表面仕上げが可能である。

【0023】本発明の焼結体においては、130W/mk以上の熱伝導率が得られる。本発明の焼結体では、希土類金属の化合物に加え、アルミナを添加し、更に粒成長を抑制していることから、熱伝導率は通常160W/mk以下となることが多い。

【0024】窒化アルミニウム焼結体の相対密度は、95%以上であることが好ましい。

【0025】好適な実施形態においては、高純度原料粉末の使用によりSi量を少なくする。このためには、AlN、Y203、Al203 ともに高純度粉末を原料として使用する。

【0026】窒化アルミニウム原料粉末は、低温で均質に焼結させる必要があるため、粒度分布がシャープで微粒なものが望ましい。市販粉末の中では、還元窒化粉末もしくはアルキルアルミニウムによる気相合成粉末が適している。直接窒化粉末の中では、粒度分布がブロード、粒径が大きく、かつ不純物量が多いものは不適当である。

【0027】希土類金属元素の酸化物粉末及びアルミナ粉末は、高純度な微粒粉末が望ましい。希土類金属元素の化合物としては、酸化物以外に、硝酸塩、硫酸塩、シュウ酸塩、アルコキシドなど、加熱によって酸化物を生成する化合物(酸化物の前駆体)を使用できる。希土類金属元素酸化物の前駆体は、粉末の状態で添加できる。また、硝酸塩、硫酸塩、アルコキシドなどの化合物を溶剤に溶解させて溶液を得、この溶液を原料粉末に添加できる。このように、酸化物の前駆体を溶媒中に溶解させた場合には、窒化アルミニウム粒子間に希土類金属元素酸化物を高度に分散させることができる。

【0028】また、原料としては、硝酸アルミニウム、硫酸アルミニウム、シュウ酸アルミニウム、アルミニウムアルコキシドなど、加熱によってアルミナを生成する化合物(アルミナの前駆体)を使用できる。アルミナの前駆体は、粉末の状態で添加できる。また、硝酸アルミニウム、硫酸アルミニウム、アルミニウムアルコキシドなどの化合物を溶剤に溶解させて溶液を得、この溶液を原料粉末に添加できる。

【0029】焼結体の成形は、乾式プレス、ドクターブレード法、押し出し、鋳込み等公知の方法を適用できる。

【0030】本発明の焼結体は、ホットプレス焼成によることが好ましく、被焼成体を 50 k g f / c m^2 以上の圧力下でホットプレス焼結させることが好ましい。ホットプレス焼成により、比較的に低温で緻密化と粒成長の抑制の両立が可

能であり、ポアフリーな焼結体が得られる。

【0031】焼結体中におけるA1N相以外の結晶相は、例えばイットリアを添加した場合には、現在のところYAG(Y3Al5012)、YAL(YAl03)、YAM(Y4Al209)の単相及び複相から構成されるが、脱粒特性との明確な関係は見出されていない。

【0032】本発明の焼結体は、シリコンウエハーの処理装置や液晶ディスプレイ製造装置のような半導体製造装置内の各種部材として、好適に用いることができる。また、フラットパネルディスプレー装置における基板として好適である。

【0033】この半導体製造用部材は、特に好ましくは、半導体製造装置用のサセプター等の耐蝕性部材である。また、この耐蝕性部材中に金属部材を埋設してなる金属埋設品に対して好適である。耐蝕性部材としては、例えば半導体製造装置中に設置されるサセプター、リング、ドーム等を例示できる。サセプター中には、抵抗発熱体、静電チャック電極、高周波発生用電極等を埋設できる。

【0034】また、本発明の焼結体は前記のように抵抗値が高く、かつ高純度であることから、高温静電チャックの基材に対して特に有用である。この静電チャックの基材の内部には、静電チャック電極の他、抵抗発熱体、プラズマ発生用電極等を更に埋設できる。

[0035]

【実施例】

(原料調製)

窒化アルミニウム粉末として、高純度還元窒化粉末 2 種類 (A,B) を使用した。いずれも、酸素を除く純度は99.9%以上であり、平均粒径は1 \sim 1.5 μ m程度である。主な不純物は、原料 A では、Si:10ppm、Fe:4ppm 、Ca :10ppm、C:320ppmであり、原料 B では、Si:35ppm、Fe:10ppm、Ca:240ppm 、C:250ppmである。イットリア粉末としては、純度99.9%以上、平均粒径 O. 3 μ m のものを使用した。アルミナ粉末としては、純度 9 9. 9 9 %以上、平均粒径 O.5 μ m のものを使用した。した。

【0036】これらの粉末を表1、表3に示す割合となるよう秤量し、イソプロ ピルアルコールを溶媒とし、ナイロン製のポット及び玉石を用いて4時間湿式混 合した。混合後、スラリーを取り出し、110 ℃で乾燥した。更に乾燥粉末を450

7

℃で5hr 大気雰囲気で熱処理し、混合中に混入したカーボンを消失除去し、原料 粉末を作製した。

【0037】(成形、焼成)

上記調合粉末を20MPa の圧力で一軸プレス成形し、直径 φ 100mm で厚さ20mm程度の円盤状成形体を作製し、焼成用黒鉛モールドに収納した。次いで、ホットプレスを用い、プレス圧力20MPa 、窒素雰囲気圧力0.15MPa 下で、所定温度、時間焼成したのち、冷却した。なお、室温から1000℃までは真空とし、1000℃以上で窒素を導入した。

【0038】 (評価)

得られた焼結体に対し、以下の評価を行った。評価結果を表1-4に示す。

嵩密度、開気孔率:アルキメデス法による水中測定。

金属成分含有量:誘導結合プラズマ(ICP)発光スペクトル分析により定量。

酸素含有量:不活性ガス融解赤外線吸収法により定量。

Y203含有量(希土類酸化物含有量):ICP によるY 分析値より、Y203量に換算

A1203 含有量:酸素定量値より、Y203含有酸素量を引き、残りの酸素が全てA1203 であるとして算出。

AlN 含有量:100 より上記Y203、Al203 含有量を差し引き算出。

結晶相:X 線回折測定装置により同定。測定条件は $CuK \alpha \times 35kV \times 20mA \times 2 \theta$ = 20-70°。

体積抵抗率:JIS2141Cに準じた方法により、室温から600 ℃程度まで測定。試験片厚みは1mm とし、電極形状を主電極径20mm、ガード電極内径30mm、外径40mm、印加電極45mmとし、電圧を500V/mm 印加し、一分後の電流値より体積抵抗率を算出。

曲げ強度: JISR1601による室温四点曲げ強度。

熱伝導率: JISR1611、レーザフラッシュ法により室温の熱拡散率を測定し算出。比熱は753J/kgKとした。

硬度:JISR1610に準じたマイクロビッカース法により測定。試験片表面は鏡面 仕上げし、荷重は500gf とした。 表面粗さ(Ra,Rt) 測定:直径75mm×厚さ1.7mm の円盤状試験片をポリッシュにより表面を鏡面加工し、表面粗さを測定した。触針先端径は2 μmRとし、長さ4.8mm で4 カ所測定し、平均した。

【0039】脱粒特性:上記鏡面仕上げした円盤状試験片の片側に電極を作製し、ヒーターの上にシリコンウエハー(直径150mm)、円盤状試験片(鏡面側をシリコンウエハーに接触)の順に積層した。次いで、ヒーターを加熱し、円盤状試験片の温度を400℃で安定化した後、シリコンウエハーと試験片の電極間に500Vを電圧印加し、シリコンウエハーと試験片を1分間吸着させた。冷却後、試験片の10-50mm²を電子顕微鏡により観察し、窒化アルミニウム粒子の脱粒個数をカウントし、直径75mmの面積(1406mm²)あたりの個数として算出した。

平均粒径:鏡面仕上げサンプルを電子顕微鏡により観察し、窒化アルミニウム 粒子30個のコード長さを平均し、1.5 を乗じた値とした。

[0040]

【表1】

			-11		 -	-				
	中 替	a E	2.0	9.	2.5	2.6	2.1	2.9	2.8	2.5
	tu	Rt (nm)	102	83	86	129	84	121	126	93
	表面	Ra (nm)	10	6	6	=	10	5	12	9
	結晶相 (AIN を	() 炎	YAG+YAL	YAG+YAL	YAG+YAL	YAL	YAG	YAL+YAM	YAG+YAL	YAG+YAL
	マイクロ カンドラ スプログ・アース	硬度	1146	1221	1179	1120	1130	1100	1110	1110
	慈 率 伝	₩/mK	139	133	160	153	141	158	148	140
	田は、東京	МРа	141	458	470	446	501	477	489	441
<u>++</u> 1	体 流 格 磁	Ω . cm	2E+16	1E+16	1E+16	8E+15	7E+15	1E+16	7E+15	7E+15
焼結体の特性	題 承	%	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
焼	神區 例3 春成	g/cm3	3.34	3.34	3.34	3,31	3.30	3.34	3.34	3.34
本	货 电	ŗ.	2	2	2	2	2	2	2	2
焼成条件	娆 還 筬 度	رړ	1800	1750	1800	1800	1750	1800	1800	1750
	A12 03	#메 백제 원급	1.5	1.5	0.75	0.2	_	0.75	1.5	1.5
	Y203	春 	2	ഹ	ഹ	က	က	ഹ	2	2
原料組成		海里 255 1114	100	100	100	100	100	100	100	100
匠	A	梅	⋖	4	~	8	<u>~</u>	<u>~</u>	<u>~</u>	<u></u>
	実 槍 回	\$	-	2	m	4	r.	ထ	7	∞

[0041]

【表2】

克 特 存	♦ 75mm 当たり	の 高 数 対	0	0	28	28	0	28	28	0
	Y203/ A1203	- - - - -	1.77	1.72	2.39	1.86	1.26	2.37	1. 75	1.71
	Z - V	%	98.61	98.61	98.74	99.17	99.04	98.75	98.62	98.63
の組成	AI 203	Mo 1 %	0.50	0.51	0.37	0.29	0.42	0.37	0.50	0.51
焼結体の組成	Y203	%- - -	0.89	0.88	0.89	0.54	0.53	0.88	0.88	0.86
	U	wt%	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03
	0	wt%	2.18	2.19	1.88	1.31	1.63	1.87	2.17	2.17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	>	w t%	3.67	3.63	3.69	2.26	2.25	3.65	3.63	3.58
の化学分析値	ပ a	w dd	ഹ	ည	4	220	220	210	210	220
*01C	o	E a a	4	4	ഹ	_		မ	9	7
焼結体	 ഗ	maa	က	က	က	25	28	27	56	27
			実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例 5	実施例6	実施例7	実施例8

[0042]

【表3】

本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	4.4	4.7
Rt (nm) 178 174 188	197	209
表面租 法 Rt (nm) (nm) (n 17 20 17 18 18 18	21	23
結晶相 (AIN を 除く) 除く) YAM YAM	YAG+YAL	YAG+YAL
マイク ロビッ カース カース 1070 1070	1060	1060
数	145	168
西 MPa 384 338 434 434	438	429
在	4E+14	3E+14
第 本 多 報 3 % 8 3 % 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<0.01	<0.01
施 9/cm3 3.29 3.32 3.34	3.30	3. 29
44	2	2
2 1800 2 1800 2 1900 2 1900 2	1900	1900
A1203 重量的 0 0 1.5	-	1.5
Y203 部 邮 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	က	22
A 100 A 100 B 100 A 100	100	100
原	8	8
丑 ☎ 2 ℃ 4	ro.	ا ما

[0043]

【表4】

	焼結体(本の化学	の化学分析値	4m1			焼結体の組成	り組成			脱粒
	·····										本
	. <u>-</u>	<u>п</u>	C a	>	0	ပ	Y203	A1203	A –	Y203/	ø 75mm
										A1203	当たり
	mdd	mdd	mdd	wt%	wt%	wt%	mo i %	mo %	% om	mol 比	の脱粒
											個数
比較例1	23	7	220	1.51	1.04	0.03	0.35	0.26	99.39	1.37	253
比較例 2	22	6	180	3.67	1.54	0.04	0.88	0.23	98.89	3 . 8 3	281
比較例3	20	∞	88	1.58	0.90	0.03	0.37	0.19	99.43	1.91	844
比較例 4	-	4	2	3.54	2.20	0.04	0.85	0.52	98.62	1.63	478
比較例 5	30	7	180	2.11	1.54	0.04	0.50	0.40	99.10	1.25	591
比較例 6	22	∞	29	1.14	0.81	0.03	0.27	0.20	99. 53	1.30	703

【0044】図1には、実施例の材料の電子顕微鏡写真を示す。この写真において、窒化アルミニウム粒子の三重点に白く孤立している粒子がY-A1-O相である。

【0045】実施例1-8および図1に示すように、窒化アルミニウム焼結体中に所定量のイットリア及びアルミナを含有させ、かつ粒径を3μm以下に制御することにより、脱粒の少ない窒化アルミニウム焼結体を得ることができる。

【0046】本焼結体の不純物金属含有量(希土類金属を除く)は数十ppmから300ppm程度であり、非常に少なく、特にSi含有量は30ppm以下と少なく、半導体製造プロセス雰囲気下での高い耐食性が得られる。

【0047】脱粒特性の良好な焼結体は、表面の硬度が高く(1100以上)、 曲げ強度が大きく(400MPa以上)、かつ表面粗さ(Ra,Rt)が小さい。不純物量の 一層少ない原料Aを用いた実施例において、特に粒成長が抑制され、脱粒特性が 良好である。熱伝導率は130~160W/mKであり、高熱伝導である。

【0048】これら焼結体の高温電気特性を図2及び図3に示す。いずれも500 ℃で1×10⁸ Ω・cm (1e8 Ω・cm) 以上の高抵抗を有する。静電チャック に適応可能な抵抗範囲を1e8 から1e12Ω・cmとした場合、いずれの材料とも300 ~500 ℃の温度範囲でこの最適な抵抗範囲を満足しており、この温度領域におい て静電チャックとしての十分な吸脱着機能を有する。また、熱伝導率が高く、粒 径の小さい焼結体ほど、体積抵抗率は高い傾向がある。熱伝導率が高い焼結体ほ ど、窒化アルミニウム粒子内の欠陥が少なく、導電キャリアとなる電子が少ない ことが原因と推察する。粒径が小さい焼結体ほど、粒界抵抗が高いものと推察す る。

【0049】比較例1-6においては、焼結体中にイットリア及びアルミナ量が 所定量ないこと、もしくは粒径が3μmより大きいこと等により、脱粒量が多く なっている。更に、硬度、強度とも小さい傾向がある。粒成長に伴い、表面のRa 、Rtとも大きくなっている。

[0050]

【発明の効果】以上述べたように、本発明の窒化アルミニウム焼結体は、窒化アルミニウム粒子が脱粒しにくく、高温領域、例えば300 \sim 500 $^{\circ}$ $^{\circ}$ において $^{\circ}$ $^{\circ}$

特2000-388183

Ω·cm以上の高抵抗値を示し、熱伝導率も比較的高い。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】実施例1の材料の電子顕微鏡写真である。
- 【図2】実施例1-4の各焼結体の体積抵抗率 ρ と温度Tとの関係を示すグラフである。
- 【図3】実施例5-8の各焼結体の体積抵抗率 ρ と温度Tとの関係を示すグラフである。

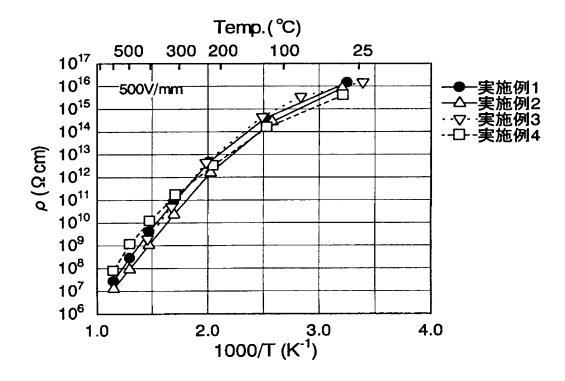
【書類名】

図面

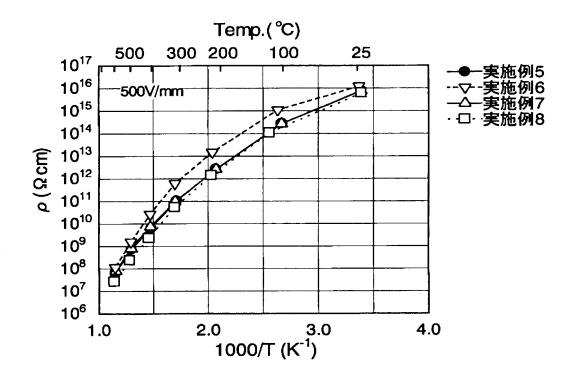
【図1】



【図2】



【図3】





【書類名】

要約書

【要約】

【課題】窒化アルミニウム粒子が脱粒しにくく、高温領域、例えば300 \sim 500 $^{\circ}$ において 10^{8} Ω · c m以上の高抵抗値を示し、熱伝導率も比較的高い窒化アルミニウム焼結体を提供すること。

【解決手段】窒化アルミニウム焼結体は、窒化アルミニウムを主成分とし、希土類金属元素を酸化物換算で0.3 mol%以上、2.0 mol%以下、アルミナを0.2 mol%以上、1.0 mol%以下含有しており、Siの含有量が80pm以下であり、窒化アルミニウム粒子の平均粒径が3μm以下である。

【選択図】

なし



出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000004064]

1. 変更年月日

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住 所 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

氏 名 日本碍子株式会社